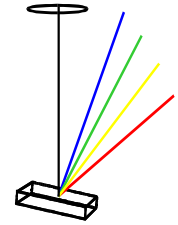


14. Deutsches Anwendertreffen

Unterstützung des Anwender bei neuartigen
Möglichkeiten der GDOS

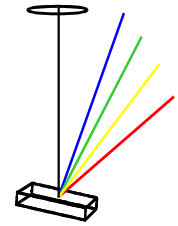
Thomas Asam, TAZ GmbH, Eurasburg



Angebot

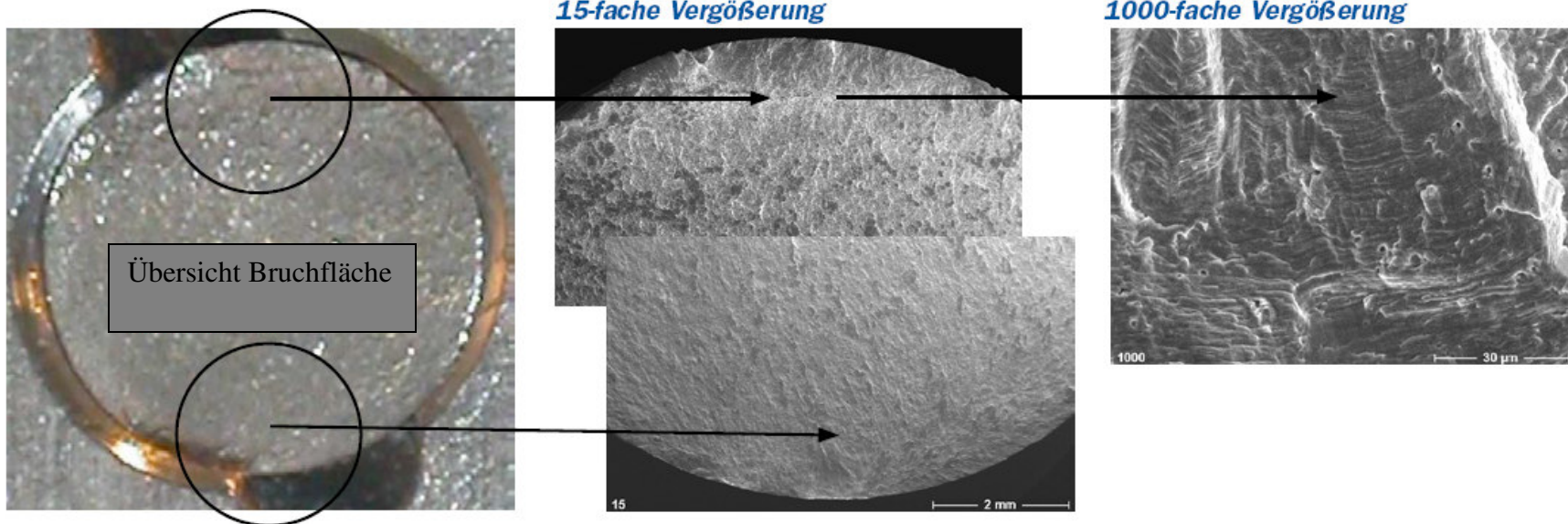
Wir bieten Ihnen an:

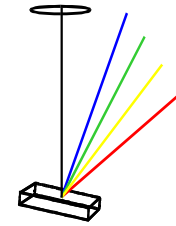
- GDOS: Unterstützung des Kunden auch vor Ort bei schwierigen Applikationen
- REM/EDX: Durchführung aller Arten von Bruch- und Schadensanalysen
- Prozeßanalyse: Optimierung komplexer Fertigungsprozesse



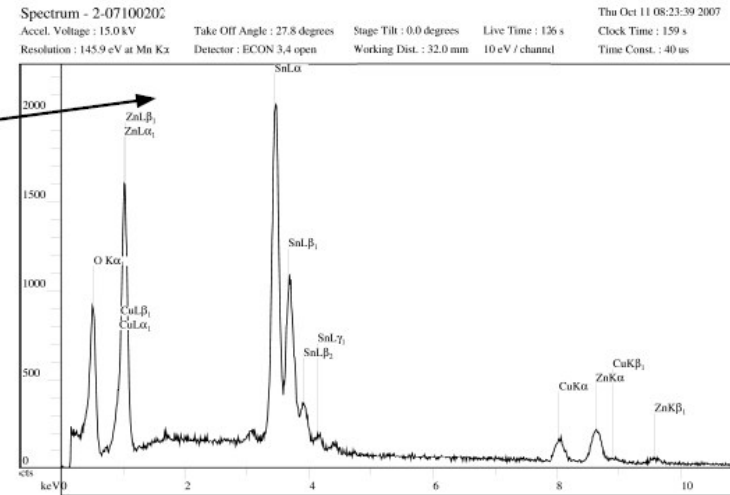
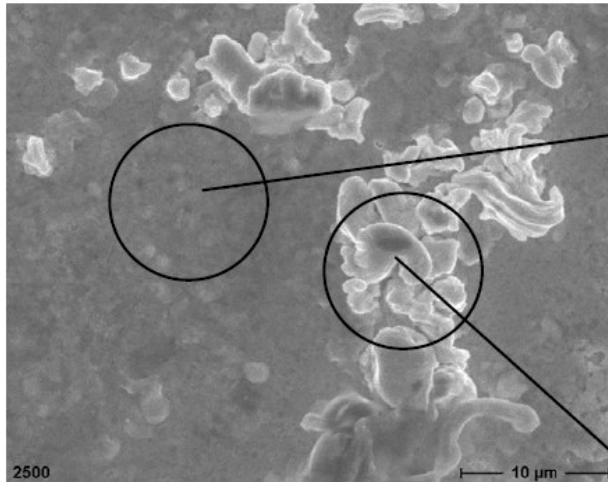
Neuerungen

Beispiel 1: Bruchfläche einer Achse – Schwingungsbruch mit ungleichmäßiger Biegebelastung



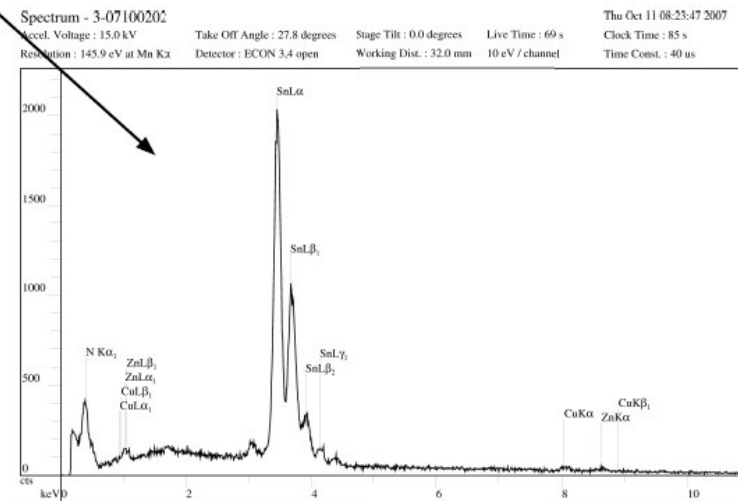


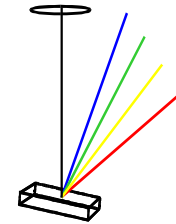
Neuerungen



Beispiel 2:
EDX-Analyse an einer galvanischen Beschichtung

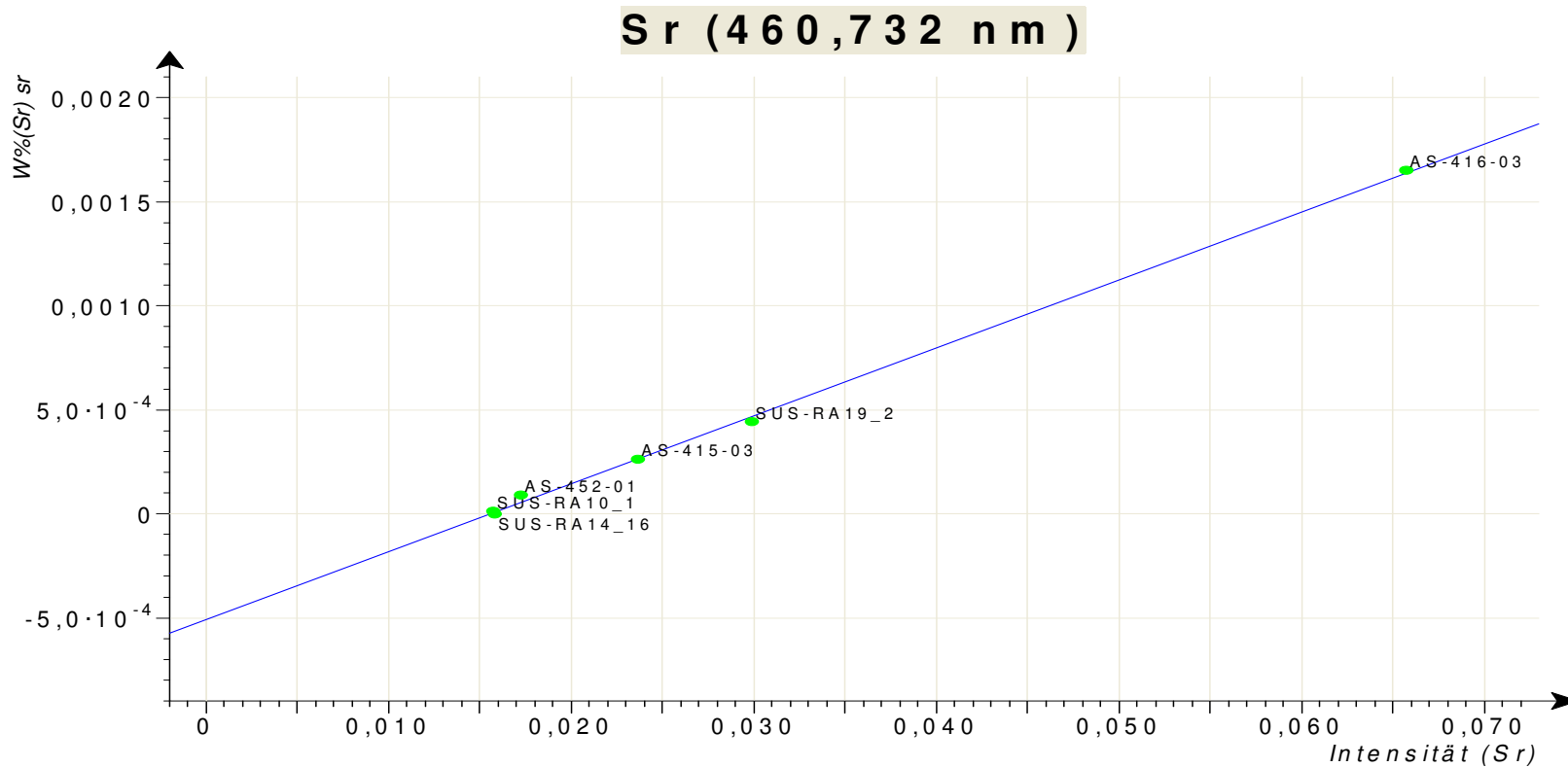
lung, welche als analytische Information genutzt werden kann. Da der normalerweise ständig bewegte Elektronenstrahl auch punktgenau angehalten werden kann, ist eine Analyse kleinster Bereiche möglich (Beispiel 2). So ist durch entsprechende Messungen hier einfach zu bestimmen, welche Quelle Partikel auf der Metalloberfläche haben könnten. Im Beispiel besteht die unregelmäßig gewachsene Struktur zum größten Teil aus Zinn, in diesem Fall das Überzugsmetall. Es handelt sich also

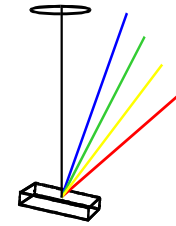




Tiefenaufgelöste Werkstoffbestimmung von Plattierschichten

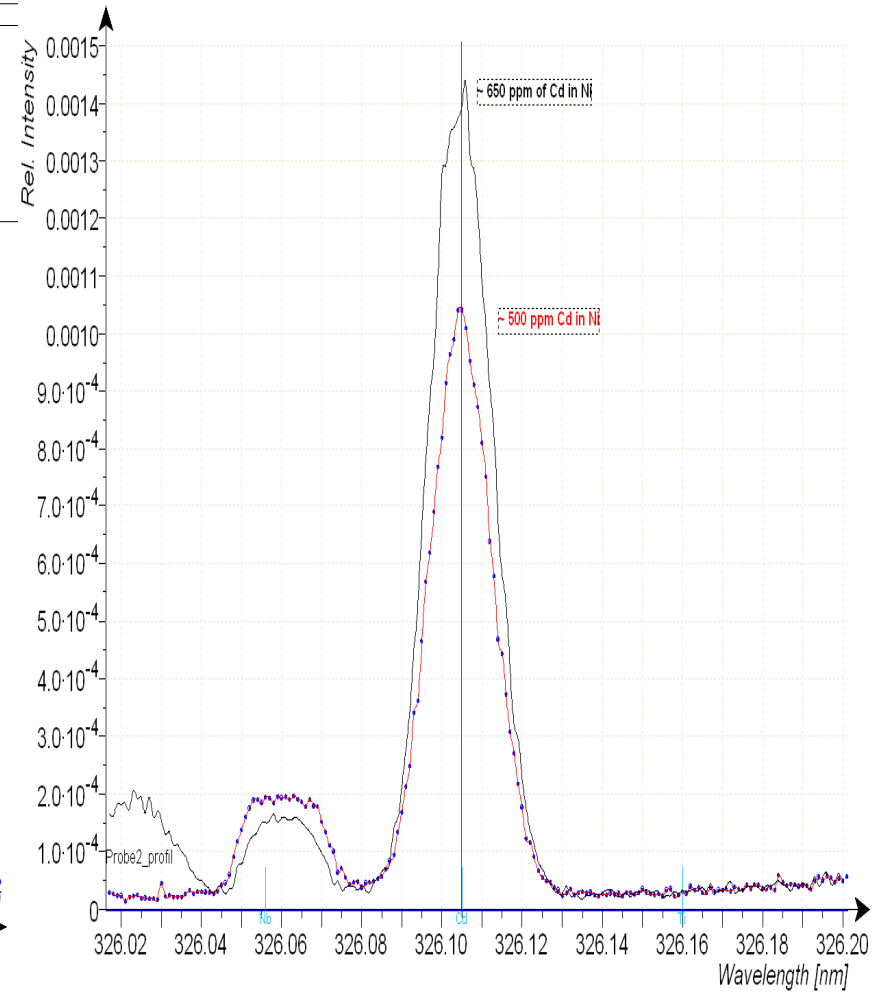
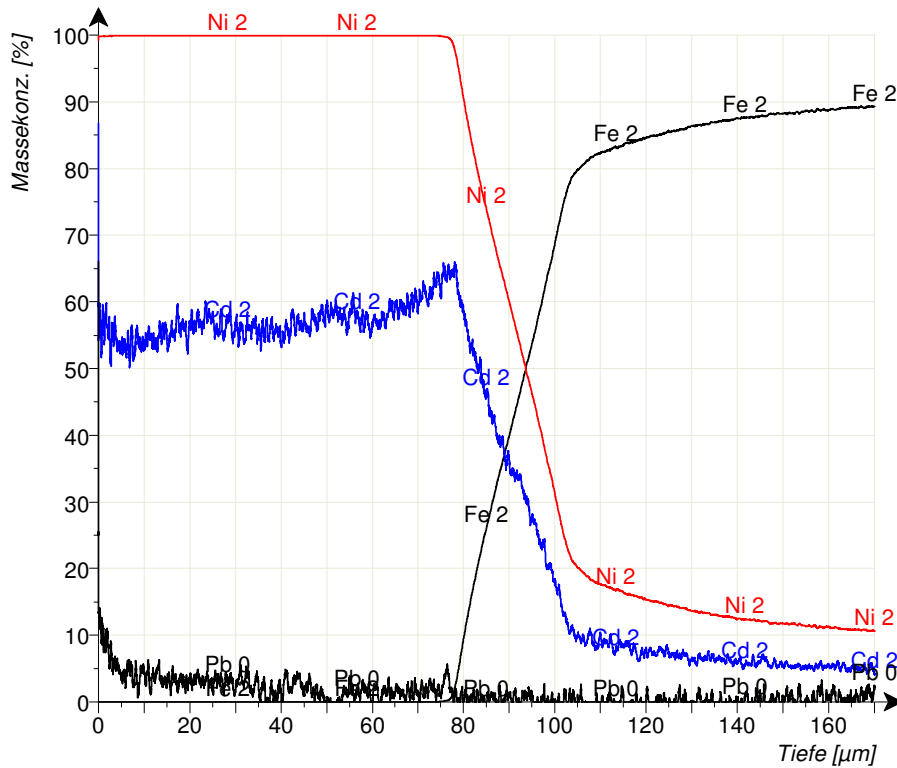
$$y = 0,033 \cdot x - 0,0005 \quad r = 0,99995 \quad \text{NWG: } 0,085 \text{ ppm}$$

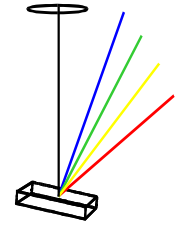




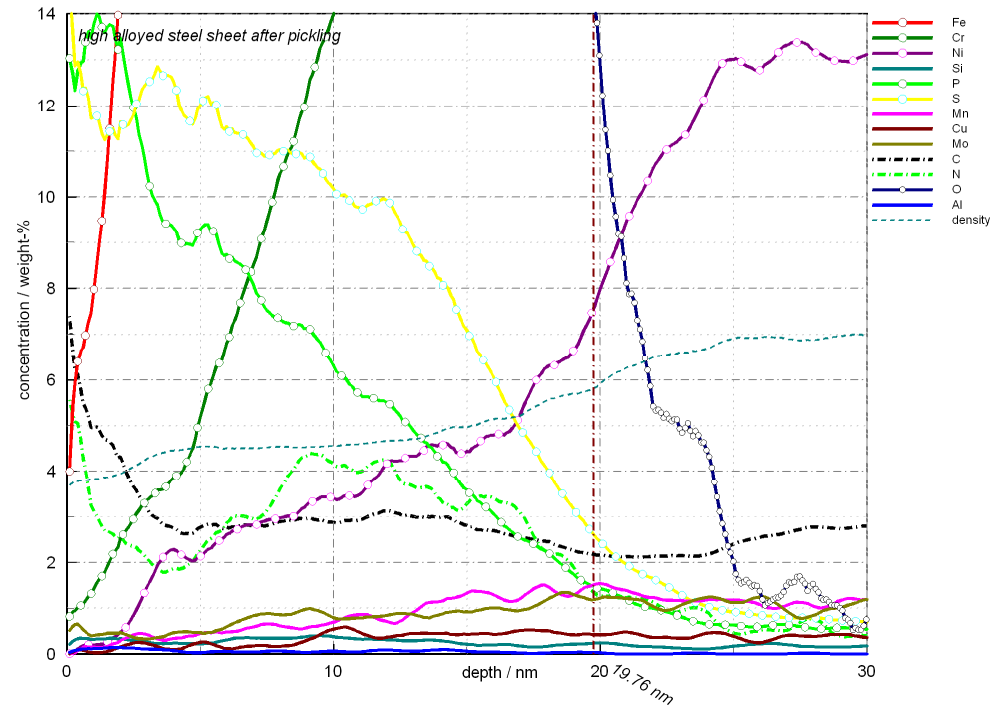
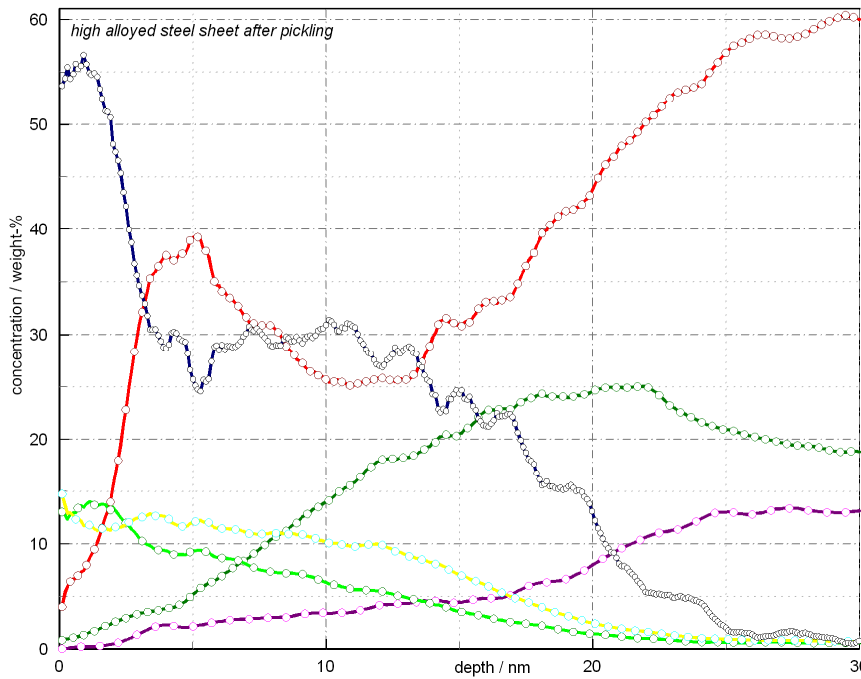
Nachweis von Cd in Nickel

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Probenbezeichnung: HSO610 (Vergleich) | GDS-Bedingungen: 120W,0.9hPa; 5000 0.40 / 1,0 | Datum/Zeit: 26.07.2007 17:54:43 |
| RAW= : MTH=07072306_cdspuren | | |
| Fe 2 - s(100%) | | |
| Ni 2 - s(100%) | | |
| Cd 2 - s(0,1%) | | |
| Pb 0 - s(1%) | | |

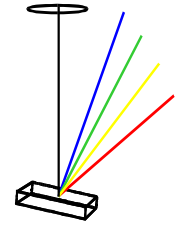




Analyse dünner und dünnster Schichten



c)



Seminar: Analyse dünner und dünnster Schichten mittels GDOS

5. und 6. Juni 2008:

Theorie:

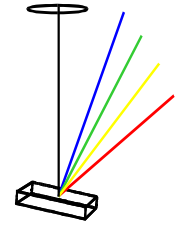
Verbesserungsmöglichkeiten der GDOS in Hinblick der Analyse dünner und dünnster Schichten (Anregungsbedingungen, apparativer Aufbau, Dichtungen, Sputtergas usw.)

Dennis Klemm, Volker Hoffmann und Michael Köster

Praxis, u. a.:

- Analyse dünner und dünnster Oxidschichten auf austenitischen Stählen
- Argon, Argon-Wasserstoff und Neon als Sputtergas
- Wiederholen des „Shimidzu-Experimentes“

Anmeldungen: Info@tazgmbh.de oder tel. : 08208/958156



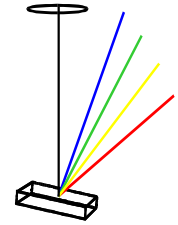
Angebot

Wir bieten Ihnen an:

- GDOS: Unterstützung des Kunden auch vor Ort bei schwierigen Applikationen
- REM/EDX: Durchführung aller Arten von Bruch- und Schadensanalysen
- Prozeßanalyse: Optimierung komplexer Fertigungsprozesse

Nehmen Sie Kontakt auf:

Info@tazgmbh.de oder Tel. : **08208/958156**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!

